



中华人民共和国国家标准

GB/T 18735—2002

分析电镜(AEM/EDS)纳米薄标样 通用规范

General specification of nanometer thin standard specimen for
analytical transmission electron microscopy (AEM/EDS)

2002-05-22 发布

2002-12-01 实施



中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语	1
4 标样的技术要求	2
5 试样的检测	2
6 包装与贮运	3

前 言

本标准无相应国际标准参照,是我国首次在该领域制定的国家标准,本标准规定的各项准则,主要适用于分析电镜,即透射电子显微镜——X射线能谱仪(AEM/EDS),依据比值法即Cliff-Lorimer法进行无机薄样品定量分析时,测量比例因子 K_{A-B} 所需纳米薄标样的通用规范和检测方法。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:武汉理工大学、中科院广州地球化学研究所。

本标准起草人:孙振亚、刘永康。